平行平晶

157 系列

特点

- 用于对千分尺测量面的平行度和平面度进行检测。
- 每组包括 4 种厚度。
- 带有配套的携带箱。

性能参数

公制型

千分尺检测范围	货号	平行平晶种类 (平行平晶厚度)
0-25mm	**157-903**	12.00, 12.12, 12.25, 12.37mm
25-50mm	**157-904**	25.00, 25.12, 25.25, 25.37mm

英制型

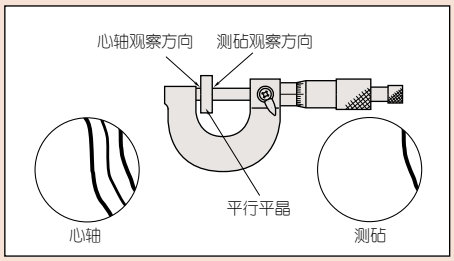
千分尺检测范围	货号	平行平晶种类 (平行平晶厚度)
0-1"	**157-901**	.5000", .5062", .5125", .5187"
1-2"	**157-902**	1.0000", 1.0062", 1.0125", 1.0187"

技术参数

平面度： 0.1μm
平行度： 0.2μm
直径： 30mm

借助于平行平晶产生的干涉条纹图案可对测量表面的平行度进行检测

通过下述方法可确定所测量表面间的平行度：在测砧上夹紧平行平晶，从心轴方向观察在测力作用下产生的干涉条纹的数量。
当平行平晶约为 1μm (0.32μm x 3=0.96μm) 时，从测砧边缘观察的条纹数一定不会超过一。



平面平晶

158 系列

特点

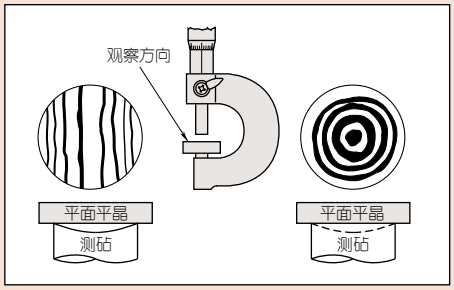
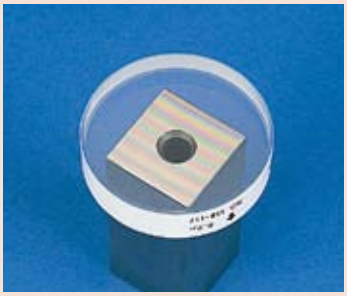
- 用于对千分尺或量块测量面的平面度进行高精度检测。

性能参数

公制型

平面度	货号	直径 / 厚度
0.2μm	**158-117**	45mm/12mm
	158-119	60mm/15mm
0.1μm	**158-118**	45mm/12mm
	158-120	60mm/15mm

英制型

平面度	货号	直径 / 厚度
.000004"	**158-122**	1.8"/.5"
	158-124	2.4"/.6"

通过平面平晶的干涉条纹图案可对测量表面的平面度进行检测